摘要

北京谱仪（BESIII）的物理目标是对tau-粲（c）物理进行高精度的实验测量并寻找新物理。在较大的动量范围内很好地鉴别区分各种带电粒子是BESIII探测器设计的要求。BESIII探测器的粒子鉴别系统主要由主漂移室（MDC）的dE/dx和飞行时间探测器（TOF）组成。飞行时间探测器的主要物理目标是粒子鉴别（PID），粒子鉴别能力的大小由相同动量不同种类粒子的飞行时间差和时间分辨决定。升级改造前的端盖飞行时间探测器采用塑料闪烁体直接耦合光电倍增管的方案，对于pi介子，时间分辨达到138ps，已经不能满足BESIII实验高精度测量的需要。2015年10月，BESIII实验完成了端盖TOF的升级改造，用时间分辨性能更好的多气隙电阻性板室（MRPC）替代了原来的闪烁体，新的探测器参与了2015~2016运行取数。对MRPC端盖TOF离线数据刻度算法进行研究，通过消除原始测量时间随粒子击中位置和过阈时间（Time over Threshold，TOT）的游动，进一步提高粒子鉴别能力，对实现BESIII高精度测量的物理目标是十分重要和不可或缺的。

国际上，相对论重离子对撞机（RHIC）上的STAR实验和大型强子对撞机（LHC）上的ALICE实验都采用了MRPC作为飞行时间探测器，结合他们各自的特点，分别采用多次样条插值和多项式拟合方法进行探测器刻度。

MRPC端盖TOF的离线刻度算法基于BESIII离线数据处理和分析软件平台（BOSS）。利用BESIII实验获得的真实数据，通过在线事例分类得到Bhabha事例做为刻度样本，对刻度算法进行了研究。研究对测量时间随带电粒子击中读出条位置，过阈时间的变化关系，以及他们之间的关联进行了分析。论文首先利用多次样条插值方法构造刻度算法，对原始测量时间随过阈时间的复杂的依赖关系进行了刻度，研究发现由于信号反射的存在，这种刻度方法的效果并不理想。通过对过阈时间的击中位置依赖关系的分析，揭示了信号在读出条内的反射造成TOT多峰的形成机制。在构造刻度公式方法中，首先对击中位置进行了刻度，这个过程同时也消除了过阈时间对击中位置的依赖，然后再对时间-幅度的关系进行刻度，收到了良好的效果，时间分辨达到\*\*ps。论文还对刻度公式的适用性问题，以及刻度算法中过阈时间和击中位置的关联性进行了讨论。

利用BESIII获取的Bhabha事例样本，对升级改造后的MRPC端盖TOF的离线数据刻度算法进行了研究，确定了刻度的流程，构造了合理的刻度公式。离线刻度的结果优于探测器硬件设计指标，新的刻度算法将会对BESIII获得高精度的测量结果产生积极的促进作用。